
**Analyse chimique des surfaces —
Spectrométrie de masse des ions
secondaires — Méthode pour
l'étalonnage de la profondeur pour
le silicium à l'aide de matériaux de
référence à couches delta multiples**

*Surface chemical analysis — Secondary-ion mass spectrometry —
Method for depth calibration for silicon using multiple delta-layer
reference materials*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn